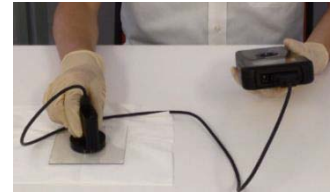


Model DUORES卓越的手持式面电阻测试仪器

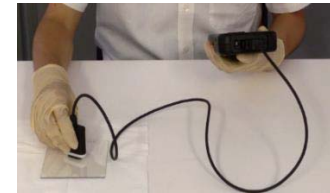
可以轻松更换使用非接触式和接触式两种测试探头



主机+接触式探头（左）+非接触式探头（右）



非接触式探头
(涡电流测试法)



接触式探头
(四探针测试法)

特色：

- <NAPSON 原创的技术>
- 可替换手持式探头支持两种测试方式
 - (1) 非接触式探头（涡电流测试法）
 - (2) 接触式探头（四探针测试法）
- 探头触碰到样品时就会自动开始测量
- 可以长达24小时的测量时间
- 最多显示100组测量数据
- 最多储存50,000组测试数据
- 可通过USB-MINI将测量数据导出
- 测量数据显示4位数的浮动小数点
- 测试结果单位： Ω/sq , s/sq , n/m

应用：

- 任意样品只要在测试范围内都可以进行测试。
(如薄膜、玻璃、纸张等)
- 导电薄膜 (ITO, TCO等)
 - LOW-E玻璃
 - 碳纳米管, 石墨烯材料
 - 金属材质 (纳米银线, 金属网格, 金属薄膜)
 - 其他材料
- * 欢迎索取更详细产品资料, 欢迎测样

样品尺寸：

任意尺寸形状样品都可以测试
(测试面积必须大于探头面积)

Model DUORES卓越的手持式面电阻测试仪器

测试范围和精度

探头类型	测量范围	测量精度
非接触式探头 (涡电流测试法)	0.5 ~ 200 ohm/sq	0.5~100ohm/sq : ≤3.0%*重复性 100~200ohm/sq : ≤5.0%*重复性
接触式探头 (四探针测试法)	0.001 ~ 4000 ohm/sq	≤±0.5%*精度

*重复性: NAPSON标准片的测量重复性 (CV = STDEVP/AVG×100%) (出货前即会校准)
*精度: NAPSON标准电阻的测试精度 (出货前即会校准)

DUORES:配置



<配置>主机, 接触式探头, 非接触式探头, 标准件 (用于校准接触式探头/非接触式探头, 各一片), 充电器。
*单一测试功能的配置; (1) 主机, 接触式探头, (2) 主机, 非接触式探头。以上两种都可供客户选择。



接触式探头
间距: 3mm



非接触式探头
测试面积: Φ25mm



4节镍锰充电电池
(并不包括在机器中)



接触式, 非接触式探头
易于更换

尺寸和电源

<尺寸>主机: W80(100)×D210×H36 mm, 约350g, {*并不含电池重量在其中}
非接触式探头: W70(φ50)×D20(φ50)×H70 mm, 约170g
接触式探头: W40×D15×H50 mm, 约85g
<电源>AC100~240V, 50/60Hz, DC9V 1A

请联系我们索取详细资料
欢迎客户踊跃试样
规格及外观变更恕不另行通知